

# 微小電流評価サービス

**AEC-Q101・AQG-324に準拠したHTRBなどに対応**

## 微小電流評価サービス

- ・パワー半導体の信頼性試験や絶縁材料のリーク電流測定などで $\mu\text{A}$ 以下の電流測定が可能。
- ・自動車、半導体、電子部品、材料メーカー様など実績多数。



- 微小電流（ $\sim\mu\text{A}$ 以下）を多チャンネルで常時モニタリング（測定）可能。
- 高電圧印可時（ $\sim 1000\text{ V}$ ）の微小電流測定が可能。
- 温度： $-40\sim 150\text{ }^{\circ}\text{C}$ 、湿度： $30\sim 95\text{ \%rh}$ まで対応。

※上記電圧・電流・温度範囲外の場合にも対応いたしますのでお問い合わせください。

## サービス活用例



- AEC-Q101、AQG-324に準拠した評価（HTRB、HTGB、H3TRB）
- 任意の温度・湿度環境で、多数を同時に測定
- コンデンサ部品や半導体製品のリーク電流測定
- 絶縁材料のリーク測定

※その他、微小電流に関してお気軽にお問い合わせください。

**- WTIでは、独自で開発、構築した環境を用いて、精度の高い微小電流測定を実現しています -**

■ お問い合わせ先 ■

**株式会社Wave Technology** URL : <https://www.wti.jp>

本社 : 〒666-0024 兵庫県川西市久代3丁目13番21号

営業部 : TEL 072-758-2938

メールでのお問い合わせ先 : [tech@wti.jp](mailto:tech@wti.jp)



## ■ 対応可能な高温・高湿バイアス試験 ■

- ◎ 微小電流（～ $\mu$ A以下）測定を多チャンネルで測定できる設備を常設。
- ◎ 高電圧印可時（～1000 V）の微小電流測定が可能。
- ◎ 温度：-40～150 °C、湿度：30～95 %rhまで対応。

※上記電圧・電流・温度範囲外の場合にも対応いたしますのでお問い合わせください。

	試験名称	記号	参照規格
AEC-Q101	高温逆バイアス試験	HTRB	MIL-STD-750-1 M1038 Method A
	高温ゲートバイアス試験	HTGB	JESD22 A-108
	高温高湿逆バイアス試験	H3TRB	JESD22 A-101
AQG-324	高温逆バイアス試験	HTRB	QL-05 IEC 60747-9:2007 section 7.1.4.1 (IGBT) IEC 60747-8:2010 (MOSFET) IEC 60747-2:2016 (diode) IEC 60749-23:2011
	高温ゲートバイアス試験	HTGB	QL-06 IEC 60747-9:2007 section 7.1.4.1 (IGBT) IEC 60747-8:2010 (MOSFET) IEC 60749-23:2011
	高温高湿逆バイアス試験	H3TRB	QL-07 IEC 60747-9:2007 (IGBT) IEC 60747-8:2010 (MOSFET) IEC 60747-2:2016 (diode) IEC 60749-5:2017

- **高温逆バイアス (HTRB)**  
最大定格温度にて、最大定格電圧をドレイン-ソース間に印加。
- **高温ゲートバイアス (HTGB)**  
最大定格温度にて、最大定格電圧をゲート-ソース間に印加。
- **高温高湿逆バイアス (H3TRB)**  
湿度85%、温度85°Cの環境にて、ドレインに最大定格の80%を印加。

